

- [6] Голубок А.О., Давыдов Д.Н., Нахабцев Д.В., Тимофеев В.А., Типисев С.Я. Тез. докл. Всесоюз. конф. „Поверхность 89”. 1989. С. 152.
- [7] Голубок А.О., Давыдов Д.Н., Нахабцев Д.Н. Научное приборостроение. „Электронная оптика”. 1989. С. 77-84.
- [8] Лихарев Д.В., Аверин К.К. // ЖЭТФ. 1986. Т. 90. С. 733.

Поступило в Редакцию
12 октября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 2

26 января 1991 г.

05.4; 06.1

© 1991

ФОРМИРОВАНИЕ $Ag - Pd$ КОНТАКТА
К $Y - Ba - CuO$ КЕРАМИКЕ И ЕГО СВОЙСТВА

К.Г. Гарцман, Ш.М. Дугужев,
Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов

С момента открытия оксидных керамик с высокотемпературной сверхпроводимостью (ВТСП) синтезирован целый ряд материалов, обладающих этим свойством. Возможное применение материалов с ВТСП в различных электротехнических и электронных устройствах ставит проблему создания простых и надежных омических контактов для них. Контакты должны обладать низким переходным сопротивлением, достаточно высокой механической прочностью, способностью к длительной работе без существенного изменения их свойств.

Известны работы [1-4], в которых опробован ряд материалов для использования их в качестве электрических контактов. Среди них наиболее часто упоминаются благородные металлы Ag , Au , Pt , а также Bi , In , Sn , Al . При этом опробовались различные способы нанесения контактного материала: нанесение пасты (как правило серебряной) с последующим вжиганием, напыление, ионная имплантация, наплавление, электроискровая сварка. Наиболее просто получаемые контакты с применением серебряных паст имеют, как правило, достаточно высокое контактное сопротивление $\sim 10^{-2}$ – 10 Ом·см 2 [1]. Лучшие результаты (10^{-4} – 10^{-5} Ом см 2) получены при напылении или ионной имплантации благородных металлов [5]. Наиболее низкие контактные сопротивления получены путем напыления или ионной имплантации благородных металлов на поверхность, прошедшую предварительную очистку ионными пучками (10^{-9} – 10^{-7} Ом·см 2) [5]. Очевидно, что стремление понизить величину

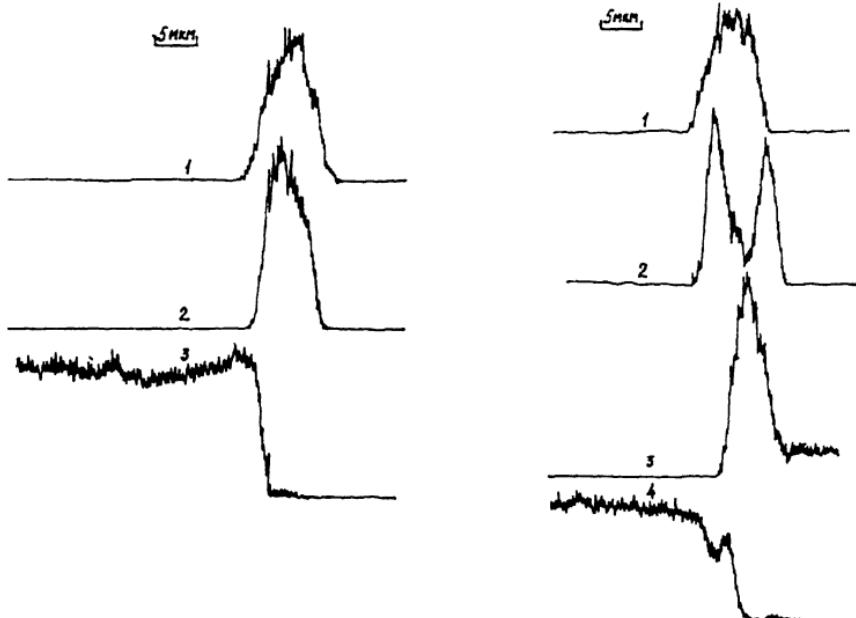


Рис. 1. Распределение элементов в поперечном сечении контакта $YBaCuO - AgPd$: 1 - $Pd L_{\alpha_1}$, 2 - $Ag L_{\alpha_1}$, 3 - $Cu K_{\alpha_1}$.

Рис. 2. Распределение элементов в поперечном сечении контакта $YBaCuO - AgPd - In$: 1 - $Pd L_{\alpha_1}$, 2 - $Ag L_{\alpha_1}$, 3 - $In L_{\alpha_1}$, 4 - $Cu K_{\alpha_1}$.

контактного сопротивления ведет к существенному усложнению технологии изготовления контактов.

В настоящей работе контакт к керамическому материалу $Y - Ba - CuO$ получен в процессе прессования предварительно синтезированного порошка $Y - Ba - CuO$ путем припрессовки к торцам таблетки тонкого слоя мелкодисперсного сплава $Ag - Pd$ (30 % Pd , $\delta \approx 3$ мкм), нанесенного на органическую пленку толщиной ~ 6 мкм. Эта пленка применяется в производстве конденсаторов для изготовления электродов. После холодного прессования проводился отжиг образцов для спекания керамики и формирования контактов. Отжиг проводился в потоке кислорода при температуре 1073 К в течение 1 часа. В результате отжига органическая основа выгорала и формировался контакт металлического сплава с ВТСП материалом. Рентгеноспектральный микронализ (РСМА), проведенный на установке $MS - 46$, показал, что полученные слои однородны и представляют собой сплошное (без проколов) ровное покрытие с хорошей адгезией. Для проведения электрических измерений тонкие токоподводы припаивались индием. Переход в сверхпроводящее состояние наблюдался при $T_c = 82.5$ К. Сопротивление контактов оценивалось по остаточному сопротивлению после перехода в сверхпроводящее состояние и оказалось равным $2.6 \cdot 10^{-3}$ Ом·см 2 , что существенно лучше, чем у контактов, полученных с применением серебряных паст.

Были приготовлены поперечные шлифы образцов и проведен РСМА при контактной области. На рис. 1 и 2 представлены распределения элементов в области контактов до и после пайки индием. Из рисунка видно, что после отжига формируется слой $Ag-Pd$ с достаточно резкой границей и равномерным распределением Ag и Pd по толщине слоя. После пайки наблюдается частичное замещение серебра индием (рис. 2).

Полученные результаты позволяют судить о возможности применения покрытия из сплава $Ag-Pd$ на тонкой органической основе для формирования контакта к материалу с ВТСП ($Y-Ba-CuO$) с достаточно низким переходным сопротивлением.

Список литературы

- [1] Kusaka T., Suzuki Y., Yotsuya T., Ogawa S., Aoyama T., Imokawa H. // Proc. 5th Int. Workshop on Future Electron Devices. 1988. P. 205-208.
- [2] Caton R., Selim R., Buoncristiani A.M., Byvik C.F. // Appl. Phys. Lett. 1988. V. 52. P. 1014-1016.
- [3] Van der Maas J., Gasparov V.A., Pavuna D. // Nature. 1987. V. 328. P. 603-604.
- [4] Tzeng Y. // J. Electrochem. Soc. 1988. V. 135. P. 1309-1310.
- [5] Talvachio J. // IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology. 1989. V. 12. P. 21-31.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
10 июля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 2

26 января 1991 г.

06.1; 06.2

© 1991

ТУННЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В КВАНТОВО-РАЗМЕРНОМ
КРЕМНИЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин,
В.Л. Суханов

Диффузия легирующей примеси в полупроводниках контролируется избыточными потоками собственных междоузельных атомов (I) и вакансий (V) с поверхности монокристалла [1]. Использование тонких слоев окисла и высоких температур термообработки приводит